# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-005884

(43) Date of publication of application: 11.01.2000

(51)Int.Cl.

B23K 20/00 B21K 25/00 B23K 20/02

H01L 21/68

(21)Application number: 10-188198

(71)Applicant: FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE

(22)Date of filing:

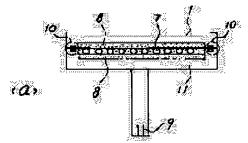
18.06.1998

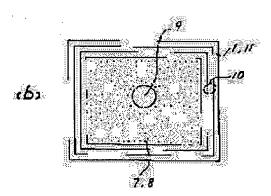
(72)Inventor: WATANABE KATSUMI

# (54) SUBSTRATE HOLDER OF SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING DEVICE, AND ITS **MANUFACTURE**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it high airtightness and endurable for the high temperature usage, even in the case of usage under high vacuum/high temperature condition. SOLUTION: According to this substrate holder, a heater and inside mounting parts such as thermocouples 7, different kind of metals or materials 8 are jointed and covered with aluminum members 1, 11, A terminal 9 for the heater and the thermocouples is also installed. The aluminum members 1, 11 are jointed with jointing parts 10 wherein intermediate members inserted in a square-shaped circular groove installed at an opposing position of the joint face are forge compressed.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

17.07.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3345852

[Date of registration]

06.09.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-5884

(P2000-5884A)

(43)公開日 平成12年1月11日(2000.1.11)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup> 職別記号 F I デーマコ	-ド( <del>参考</del> )
B 2 3 K 20/00 3 1 0 B 2 3 K 20/00 3 1 0 L 4 E	067
B 2 1 K 25/00 B 2 1 K 25/00 Z 4 E	087
B 2 3 K 20/02 B 2 3 K 20/02 5 F	0 3 1
H 0 1 L 21/68 H 0 1 L 21/68 N	

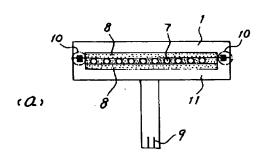
		審査請求	未請求 請求項の数3 FD (全 6 頁)
(21)出顧番号	特願平10-188198	(71)出願人	000005290 古河電気工業株式会社
(22) 出顧日	平成10年 6 月18日 (1998. 6. 18)	(74)代理人	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 渡邉 克己 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号古河 電気工業株式 会社内 100102624 弁理士 煤孫 耕郎 時) 4E067 AA05 AB03 AD02 BJ02 DA01 DA02 DA03 DA13 DA17 EB00 4E087 BA04 CA51 CC01 HA91 5F031 FF03 KK02

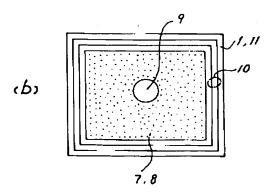
## (54) 【発明の名称】 半導体製造装置の基盤ホルダー及びその製造方法

## (57)【要約】

【課題】 高真空・高温下で使用しても高い気密性を有し、高温使用にも耐え得る半導体製造装置の基盤ホルダー及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 加熱ヒーター及び熱電対(7)、異種金属若しくは異種材料(8)のような内部装着部品をアルミニウム部材(1)(11)を接合して包み込んでいる基盤ホルダーで、加熱ヒーター及び熱電対の端子(9)が設けられている。アルミニウム部材(1)(11)は、それらの接合面の対向位置に設けられた四角形の環状溝に挿入介在されている中間部材を鍛圧圧縮した締結部(10)で接合されている。





BEST AVAILABLE COPY

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 内部装着部品を複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーにおいて、前記複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面の対向位置にそれぞれ設けられた環状溝、及び前記環状溝に挿入充満させるアルミニウム又はアルミニウム合金の中間部材とからなり、銀圧により接合させた締結部を有することを特徴とするアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダー。

【請求項2】 内部装着部品を複数のアルミニウム又は アルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体 製造装置の基盤ホルダーの製造方法において、前記複数 のアルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面の対 向する位置に環状溝をそれぞれ設け、前記環状溝にアル ミニウム又はアルミニウム合金の中間部材を挿入して組 み合わせ、銀圧により前記環状溝に前記中間部材を充満 させて締結し接合することを特徴とする内部装着部品を 複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合し て包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーの製造 方法。

【請求項3】 複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面及び中間部材を酸、アルカリ、水洗等を適宜組合わせて洗浄し、組み合わせ、鍛圧することを特徴とする請求項2記載の内部装着部品を複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーの製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造装置や 液晶製造装置の基盤ホルダー(以下「半導体製造装置の 基盤ホルダー」という)及びその製造方法に係り、特に 加熱ヒーター、熱電対、電極のような内部装着部品、ま た適宜に異種金属、異種材料をアルミニウム又はアルミ ニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装 置の基盤ホルダー及びその製造方法に関するものであ る。

### [0002]

【従来の技術】半導体製造装置の基盤ホルダーは、加熱 ヒーター、熱電対、電極、異種金属、異種材料のような 内部装着部品をアルミニウム又はアルミニウム合金で包 み込んだもので、図5~図7に示すようなものが知られ ている。図5は、加熱ヒーター及び熱電対(7)、異種 金属若しくは異種材料(8)のような内部装着部品をア ルミニウム部材(1)(11)で覆い、その外周を溶接 した基盤ホルダーである。また加熱ヒーター及び熱電対 の端子(9)が設けられている。

【0003】図6は、加熱ヒーター及び熱電対(7)、 異種金属若しくは異種材料(8)のような内部装着部品 を鋳包み、アルミニウム部材(18)で包み込んだ基盤 ホルダーであり、加熱ヒーター及び熱電対の端子(9)が設けられている。図7は、加熱ヒーター及び熱電対(7)、異種金属若しくは異種材料(8)のような内部装着部品をアルミニウム部材(1)(11)で覆い、接触面(17)にOリング(15)を設け、ボルト(16)で締めた基盤ホルダーであり、加熱ヒーター及び熱電対の端子(9)が設けられている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術の図5に示す溶接による基盤ホルダーは、全周を溶接するのでコストが高いという問題があり、また溶接時に生じるピンホールや巻き込まれたガスより、高真空下のチャンバー内で使用する場合、そのピンホールからの漏れやガスによる影響で真空度が低下し、製造した半導体の信頼性が低下し、歩留まりが悪くなる問題があった。図6に示す内部装着部品を鋳包んだものは、アルミニウム若しくはアルミニウム合金を溶融状態で使用するので内部に組み込む装着部品の損傷の問題があり、またアルミニウム部材(18)を鋳包む際に生じるピンホール及び巻き込まれたガスの影響で高真空下のチャンバー内で使用する場合、真空度が低下し製造した半導体の信頼性が低下し、歩留まりが悪くなる問題があった。

【0005】また、図7に示すOリングを用いたシールパッキンとボルト締めによるものでは、シールパッキンの耐熱性能に影響され、使用温度が300℃を越える温度域では使用できないという問題があり、またシールパッキン用溝及びボルトホールを設けるスペースが必要であり、コンパクトにできないという問題があった。本発明は、高真空・高温下で使用しても高い信頼性、即ち高い気密性を有し、高温使用にも耐え得る半導体製造装置の基盤ホルダー及びその製造方法を提供するものである。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を達成するためのもので、内部装着部品を複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーにおいて、前記複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面の対向位置にそれぞれ設けられた環状溝、及び前記環状溝に挿入充満させるアルミニウム又はアルミニウム合金の中間部材とからなり、鍛圧により接合させた締結部を有することを特徴とするアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーである。

【0007】また本発明は、内部装着部品を複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーの製造方法において、前記複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面の対向する位置に環状溝をそれぞれ設け、前記環状溝にアルミニウム又はアルミニウム合金の中間部材

を挿入して組み合わせ、銀圧により前記環状溝に前記中間部材を充満させて締結し接合することを特徴とする内部装着部品を複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材を接合して包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーの製造方法である。さらに本発明は、複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面及び中間部材を酸、アルカリ、水洗等を適宜組合わせて洗浄し、組み合わせ、銀圧することを特徴とするものである。

#### [0008]

【作用】本発明においては、内部装着部品を包む複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材が、その接合面の対向する位置にそれぞれ設けられた環状溝に中間部材を挿入し鍛圧により充満させ締結、接合させたものであるので高度な密閉度を確保することができるものである。また接合されるアルミニウム又はアルミニウム合金部材の鍛圧に際し、締結、接合部分を圧縮して金属接合させることにより、さらに高い密閉度を確保することができるものである。このように締結部を金属接合することにより使用温度が500℃前後の高温でも高度な密閉度を保つことができる。

【0009】また本発明の半導体製造装置の基盤ホルダーは、アルミニウム又はアルミニウム合金部材で全面が 覆われているので腐食ガスに対する耐食性を有する。例 えば半導体の製造においてシランガスが用いられる場合、シランガスの成分に含まれるSiでホルダー、チャンバー等が汚染される。それを洗浄するためにフッ素を含有する洗浄ガスを通気させるが、アルミニウム又はアルミニウム合金部材で全面が覆われているのでこのような洗浄ガス(フッ素含有ガス)に対する耐食性を有しているものである。

#### [0010]

【発明の実施の形態】本発明において、半導体製造装置や液晶製造装置の基盤ホルダーの内部装着部品としては、例えば加熱ヒーター、熱電対、電極、異種金属、異種材料が挙げられ、各種の半導体製造の工程に応じて適宜必要な内部部品が装着される。加熱ヒーター、熱電対、電極等は基盤ホルダーに機能を持たせるものである。さらに必要であれば異種金属、異種材料により基盤ホルダーに特性を付与するものである。例えばセラミック繊維、セラミックウィスカー、あるいは炭素繊維等を分散させたアルミマトリックス複合材は基盤ホルダーの熱膨張率を少くし、高温での強度、剛性を高して熱変形しにくくすることができる。

【0011】内部装着部品を包み込むアルミニウム又はアルミニウム合金は、材質、製法、については特定しないが、耐リーク性を考慮すると、内部欠陥の少ない圧延板、鍛造品を素材とすることが望ましい。また、洗浄ガスに対する耐食性の観点からはアルミ材質は純度99.5%以上のJIS1050が最も望ましいが、JIS1100(SiとFe:1.0%、Cu:0.05~0.

20%、Mn: 0. 05%以下、Zn: 0. 10%以 下、残部A1)、JIS3003(Si:0.6%以 下、Fe:0.7%以下、Cu:0.05~0.20 %、Mn:1.0~1.5%、Zn:0.10%以下、 残部A1)、JIS6063(Si:0.20~0.6 %、Fe: 0.35%以下、Cu: 0.10%以下、M n:1.0%以下、Mg:0.45~0.9%、Cr: 0.10%以下、Zn:0.10%以下、Ti:0.1 0%以下、残部A1)、JIS6061(Si:0.4 0~0.8%、Fe: 0.7%以下、Cu: 0.15~ 0.40%、Mn:0.15%以下、Mg:0.8~ 1. 2%, Cr: 0. 04~0. 35%, Zn: 0. 2 5%以下、Ti:0.15%以下、残部Al)、JIS 3004 (Si:0.03%以下、Fe:0.7%以 下、Cu: 0. 25%以下、Mn: 1. 0~1. 5%、 Mg: 0.8~1.3%、Zn: 0.10%以下、残部 A1) 等を用いることができる。

【0012】本発明において、アルミニウム又はアルミニウム合金部材は複数部材、例えば2個の部材を接合し、内部装着部品を包むもので、アルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面の対向する位置に内部装着部品を包む外周で全周に環状溝を設ける。環状溝は、接合面の対向する位置に内部装着部品を包むように、その外周に単独でも良いが、2重または3重とすることにより、より高いシール性を確保することができる。また環状溝は、接合面に四角形の環状に設けても、また円形環状に設けてもよい。また環状溝の断面形状は、コの字状(長形)、台形、逆台形等が用いられる。環状溝部への鍛圧時の空気の巻き込み等を考慮すると、断面コの字状(長形)、台形が好ましい。環状溝は、例えば機械加工により成形する。

【0013】中間部材は、接合面に形成されている環状 溝に対応した環状部材、あるいは複数に分割されたもの を環状溝の全周に挿入する。中間部材の材質は、アルミ ニウム又はアルミニウム合金で、例えば純度99.5% 以上の純アルミニウムが最も圧着しやすいものである が、純度99.0%以上のJIS1100、Al-Mn 系のJIS3003やJIS3004、またはJIS6 063やJIS6061等の合金の場合でも圧着させる ことができる。

【0014】特に、中間部材は、接合する部材と同一の材料が鍛圧圧縮時のメタルフローにより複数部材同志が圧着し物理的に金属接合し易いので好ましい。中間部材の断面形状は、コの字状(長形)、台形、逆台形等が用いられる。また、その断面の大きさ(面積)は環状溝に充満させるので、環状溝の大きさ(面積)とほぼ同じ、又はやや大き目がよい。例えば環状溝に挿入し易いように、中間部材の断面は、環状溝の巾よりやや小さくし、環状溝の深さよりやや大きくする。中間部材の長さは、2っの環状溝の深さの和より数%~数10%長くするこ

とが好ましい。

【0015】本発明の基盤ホルダーの製造方法については、アルミニウム若しくはアルミニウム合金部材の内部に装着されるヒーター及び熱電対、さらに必要で有れば異種金属若しくは異種材を包み込むためのスペースをあらかじめ形成し、その接合面の外周(全周)で対向する位置に環状溝を機械加工で成形する。例えば環状溝は、その溝の深さを中間部材の高さより数%~数十%浅く製作する。このように製作したアルミニウム若しくはアルミニウム合金部材のホルダーに内部装着部品(ヒーター等)を組入れた後、この凹状の環状溝に中間部材を挿入して組み合わせ加圧する。中間部材が圧縮し、体積変形を生じて幅溝に強固に圧縮を生じ、強固なシール性を持つこととなる。この場合、内部装着部品に影響を与えないように環状溝に中間部材を挿入した部分のみを鍛圧圧縮してもよい。

【0016】このように凹状の環状溝に中間部材を挿入して組み合わせ、鍛圧により環状溝に中間部材を充満させて締結し接合する。これは外部が高真空状態でも包み込んだ内部部品からリークすることなく、十分な密閉度を有するものである。この密閉度、即ち耐リーク性は、半導体製造装置で求められる高真空に対応できるものであり、具体的には、 $10^{-8}\sim10^{-10}$  Torrの高真空に対応できるものである。

【0017】また、複数のアルミニウム又はアルミニウム合金部材の接合面及び中間部材を洗浄してこれらを組み合わせ鍛圧することがことが望ましい。これにより、素材の酸化皮膜が除去され鍛圧時の金属接合が確保される結果、接合面がより高度な密閉度が得られるものである。鍛圧の前処理としての表面洗浄は、アルミニウムスはアルミニウム合金部材の接合面及び中間部材の表面の油とり及び/又はアルカリ溶液によるエッチング等を適宜に組みておこなうもので、例えば、①硝酸で表面の油とり、②水洗、③苛性処理(アルカリ溶液によるエッチング)、②水洗、⑤硝酸での洗浄、⑥水洗、⑦湯洗等の適宜の工程を組みて表面を清浄にするものである。2個の部材は、環状溝の全周に中間部材を挿入後鍛圧し、環状溝に中間部材を充満密封させ、さらに鍛圧することにより両者を金属接合させるものである。

[0018]

【実施例1】本発明の実施例1について、図1、図2を 参照して説明する。図1は本発明実施例の半導体製造装 置の基盤ホルダーを示す図で、図1(a)は断面図、図 1(b)平面図である。加熱ヒーター及び熱電対

(7)、異種金属若しくは異種材料(8)のような内部 装着部品をアルミニウム部材(1)(11)を接合して 包み込んでいる基盤ホルダーである。また加熱ヒーター 及び熱電対の端子(9)が設けられている。アルミニウ ム部材(1)(11)は、それらの接合面の対向位置に 設けられた四角形の環状溝に挿入介在されている中間部 材を鍛圧圧縮した締結部(10)で接合されている。 【0019】図2(a)(b)は、本発明実施例の基盤ホルダーの製造工程を示す図で、図2(a)に示すように、アルミニウム部材(1)に内部部品装着スペース(2)、アルミニウム部材(11)に内部部品装着スペース(12)を形成し、加熱ヒーター及び熱電対等の内部装着部品(7)を包み込むようになっている。アルミニウム部材(1)の接合面には断面コの字状の環状溝(3)を設け、またアルミニウム部材(11)の接合面には対向する位置に断面コの字状の環状溝(13)に中間部材(4)を挿入し組み合わせ、鍛圧圧縮しアルミニウム部材(1)と(11)を締結し接合するものである。

【0020】図2(b)は、図2(a)の環状溝(3)(13)、中間部材(4)を拡大した図で、環状溝と中間部材の具体的関係を示す。環状溝(3)の深さA、幅B、環状溝(13)の深さC、幅D、及び中間部材(4)の長さE、幅Fのとき、

 $(A+C) \leq E$ 

 $(A \times B + C \times D) \leq E \times F$ 

 $(A+C)/E \le 1$ 

B≥F, D≥F

の関係に形成して、部材(1)(11)を組み合わせ鍛圧圧縮し、接合してシール性を確保するものである。具体的に、部材(1)、(11)、中間部材(4)は純度99.5%以上の純アルミニウムを用い、環状溝(3)の深さA 5mm、幅B 7mm、環状溝(13)の深さC 5mm、幅D 7mm、及び中間部材(4)の長さE 12mm、幅F 6.8mm、のものを鍛圧圧縮し環状溝(3)(13)に中間部材(4)に充満された。得られた基盤ホルダーは、10-8~10-10 Torrの高真空でもリークが生じなかった。

[0021]

【実施例2】本発明の実施例2について、図3を参照し て説明する。図3(a)に示すように、アルミニウム部 材(1)にスペース(2)、アルミニウム部材(11) にスペース(12)を形成し、加熱ヒーター及び熱電対 等の内部装着部品(7)を包み込むようになっている。 アルミニウム部材(1)の接合面には断面コの字状の環 状溝(3)を2重に設け、またアルミニウム部材(1 1)の接合面には対向する位置に断面コの字状の環状溝 (13)を2重に設ける。アルミニウム部材(11)の 2重の環状溝(13)にそれぞれ中間部材(4)を挿入 し、次いで図3(b)に示すように、矢印方向に鍛圧圧 縮しアルミニウム部材(1)と(11)を締結接合し、 内部装着部品(7)をアルミニウム部材(1)(11) で包み込んでいる半導体製造装置の基盤ホルダーを製造 するものである。なお、図3(a)では、中間部材 (4)が環状溝(13)に一部が挿入されたものである

が、中間部材(4)を環状溝(13)に完全に挿入した 後に鍛圧を行ってもよい。

[0022]

【実施例3】本発明の実施例3について、図4(a)

- (b) (c) を参照して説明する。 図4 (a) (b)
- (c)は、アルミニウム又はアルミニウム合金部材
- (1)(11)の接合面の対向位置に設けられた環状溝の形状、及び中間部材の例を示す図である。図4(a)では、部材(1)の環状溝(31)は断面コの字状で凹みを設けたものであり、部材(11)の環状溝(32)は断面コの字状で幅広のものである。中間部材(41)は凸型で、環状溝(32)に対応した幅広部と環状溝
- (31)対応した幅狭部の先端隅取りしているものである。この例では、幅広の環状溝(32)は機械加工が容易であり、また環状溝(31)対応した幅狭部を先端隅取りしているので、中間部材(41)に容易に環状溝
- (31)を挿入することができ、また環状溝(31)に 凹みを設けているので鍛圧時の空気の巻き込みは起り難 いものである。

【0023】図4(b)では、部材(1)の環状溝(33)は断面台形のものであり、部材(11)の環状溝(34)も断面台形のものである。また中間部材(42)は環状溝(33)(34)が台形である。この例では、環状溝(33)(34)が台形であるので中間部材(42)と環状溝(33)(34)が5形であるので中間部材(42)と環状溝(33)(34)の挿入が容易である。図4(c)では、部材(1)の環状溝(35)は断面コの字状、部材(11)の環状溝(36)も断面コの字状のものであり、中間部材(43)は長円である。この例では、中間部材(43)と環状溝(35)

[0024]

めることができる。

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

(36)の挿入が容易であり、角隅に内在した空気を溜

環状溝に中間部材を鍛圧圧縮して締結させることで高度な密閉度が得られるという効果を有する。即ち、締結部のシールは鍛接され、接合部が物理的に圧着することで、ピンホール等の欠陥を防止でき、高真空度で使用しても高い気密性を保つことができる。また両者が金属接合しているため使用温度を500℃前後の高温でも高とで、締結部が金属接合した半導体製造装置の基盤ホルダーが得られるので、低コストでの製造が可能となる。さらに、従来技術のように溶湯を使用しないため、基盤ホルダー内に入れる部品、部材を高温の溶湯にさらすことがなく装着できる。またボルトナット締結によるスペースを必要とせず、また高精度加工のロリング溝を必要としないので安価に製造できるという効果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例1の半導体製造装置の基盤ホルダーを示す図

【図2】本発明実施例1の基盤ホルダーの製造工程を示す図

【図3】本発明実施例2の基盤ホルダーの製造工程を示す図

【図4】本発明の実施例3を示す図

【図5】従来例を示す図

【図6】従来例を示す図

【図7】従来例を示す図

【符号の説明】

- 1,11 アルミニウム部材
- 10 締結部
- 3,13 環状溝
- 4 中間部材
- 7 加熱ヒーター及び熱電対
- 8 異種金属若しくは異種材料

【図5】

【図6】

8 7 18

【図7】

